

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005年6月2日 (02.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/050511 A1

(51) 国際特許分類:

G06F 17/60

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社アイ・ピー・ピー (INTELLECTUAL PROPERTY BANK CORP.) [JP/JP]; 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目21番19号 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/004099

(22) 国際出願日:

2004年3月24日 (24.03.2004)

(71) 出願人 および

(25) 国際出願の言語:

日本語

(72) 発明者: 増山博昭 (MASUYAMA, Hiroaki) [JP/JP]; 〒5600054 大阪府豊中市桜の町6丁目9番30号 - 501 Osaka (JP).

(26) 国際公開の言語:

日本語

(72) 発明者: および

(30) 優先権データ:  
特願2003-396346

2003年10月23日 (23.10.2003) JP

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 宮本薰 (MIYAMOTO, Kaoru) [JP/JP]; 〒1710051 東京都豊島区長崎6丁目29番3号 ガイナホワイト長崎102号 Tokyo (JP).

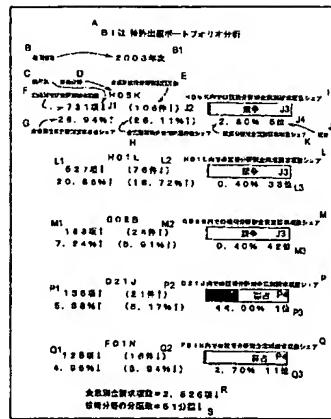
特願2003-423855

2003年12月19日 (19.12.2003) JP

/統葉有/

(54) Title: ENTERPRISE EVALUATION DEVICE AND ENTERPRISE EVALUATION PROGRAM

(54) 発明の名称: 企業評価装置並びに企業評価プログラム





(74) 代理人: 吉田 芳春 (YOSHIDA, Yoshiharu); 〒1050001  
東京都港区虎ノ門一丁目21番19号 秀和第二虎ノ門ビル 6階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ヨーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。